
Merjenje kakovosti električne energije v napajalnih sistemih - 2. del: Zahteve za funkcionalne preskuse in negotovost

Power quality measurement in power supply systems - Part 2: Functional tests and uncertainty requirements

Messung der Spannungsqualität in Energieversorgungssystemen - Teil 2: Funktionsprüfungen und Anforderungen an die Messunsicherheit

Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation - Partie 2: Essais fonctionnels et exigences d'incertitude

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5de5d636-5b43-4c7b-ba9f-cb198a851d36/sist-en-62586-2-2014-ac-2015>

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 62586-2:2014/AC:2014

ICS:

17.220.20	Merjenje električnih in magnetnih veličin	Measurement of electrical and magnetic quantities
-----------	---	---

SIST EN 62586-2:2014/AC:2015 **en,fr,de**

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[SIST EN 62586-2:2014/AC:2015](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5de5d636-5b43-4c7b-ba9f-cb198a851d36/sist-en-62586-2-2014-ac-2015)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/5de5d636-5b43-4c7b-ba9f-cb198a851d36/sist-en-62586-2-2014-ac-2015>

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALEIEC 62586-2
Edition 1.0 2013-12IEC 62586-2
Édition 1.0 2013-12POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER
SUPPLY SYSTEMS –MESURE DE LA QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION –Part 2: Functional tests and uncertainty
requirementsPartie 2: Essais fonctionnels et exigences
d'incertitude

CORRIGENDUM 1

**Table 3 – Testing points for each
measured parameter**

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P1", for classes A and S, "Threshold dip-" by "Threshold dip+".

Replace, in the row "Dips/Interruptions" and column "Testing point P2", for class A and class S, "Threshold dip+" by "Threshold dip-".

6.4.1 General

In the existing table, in the row "A4.1.4" and column "Testing points according to Table 3", replace "P2 for Dips/Int." by "P3 for Dips/Int."

6.6.1 Measurement method

In the table, in the row "A6.1.6" and column "Target of the test", replace the existing text by:

"Check that a properly designed anti-aliasing filter is used on the device, providing (in combination with oversampling) an attenuation exceeding 50 dB for any frequency producing an alias below or up to the 50th harmonic."

7.12.3 Influence of temperature

In the table, in all the rows of the column

**Tableau 3 – Points d'essais pour
chaque paramètre mesuré**

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P1", pour la classe A et classe S, "Creux-seuil" par "Creux+ seuil".

Remplacer, dans la ligne "Creux, interruptions" et la colonne "Point d'essai P2", pour la classe A et classe S, "Creux+ seuil" par "Creux- seuil".

6.4.1 Généralités

Dans le tableau existant, dans la ligne "A4.1.4" et la colonne "Points d'essai selon le Tableau 3", remplacer "P2 pour les Creux/Int." par "P3 pour les Creux/Int."

6.6.1 Méthode de mesure

Dans le tableau, dans la ligne "A6.1.6" et la colonne "Cible de l'essai", remplacer le texte existant par:

"Vérifiez qu'un filtre anti-repliement correctement conçu est utilisé sur l'appareil, en fournissant (en combinaison avec suréchantillonnage) une atténuation dépassant 50 dB de toutes les fréquences produisant un alias au-dessous ou jusqu'à la 50ème harmonique."

7.12.3 Influence de la température

Dans le tableau, dans toutes les lignes de

"Test criterion (if test is applicable)",
replace "TC10s(ue)" by:

For "Clock uncertainty (check drift on a 8 h duration)": Less than 333 ms.

For other tests on frequency:
Measurement value will be used for further
calculation. Check each 10 s
measurement complies with the limits (e.g.
Figure 2 of IEC 62586-1).

For other tests on voltage magnitude:
Check each 10/12 cycles measurement
complies with the limits.

7.12.4 Influence of power supply voltage

In the table, in all the rows of the column
"Test criterion (if test is applicable)"
replace "TC10s(ue)" by:

For tests on frequency: Measurement
value will be used for further calculation.
Check each 10 s measurement complies
with the limits.

For tests on voltage magnitude:
Measurement value will be used for further
calculation. Check each 10/12 cycles
measurement complies with the limits.

E.3.2 Result evaluation

Replace the existing equation:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{\text{RMS}}(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

by:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{\text{RMS}}(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

E.4.2 Result evaluation

Replace the existing equation:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

by:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

la colonne "Critère d'essai (si l'essai
s'applique)", remplacer "TC10s(ue)" par:

Pour "Incertitude d'horloge (vérifiez la
dérive sur une durée de 8 h)": Moins de
333 ms.

Pour d'autres essais sur la fréquence:
Valeur de mesure sera utilisée pour
d'autres calculs. Vérifiez que chaque
mesure de 10 s est conforme aux limites
(par exemple Figure 2 de la IEC 62586-1)

Pour d'autres essais pour l'amplitude de
tension: Vérifiez que chaque mesure de
10/12 cycles est conforme aux limites.

7.12.4 Influence de la tension d'alimentation

Dans le tableau, dans toutes les lignes de
la colonne "Critère d'essai (si l'essai
s'applique)", remplacer "TC10s(ue)" par:

Pour des essais sur la fréquence: Valeur
de mesure sera utilisée pour d'autres
calculs. Vérifiez que chaque mesure de
10 s est conforme aux limites.

Pour des essais sur l'amplitude de
tension: Valeur de mesure sera utilisée
pour d'autres calculs. Vérifiez que chaque
mesure de 10/12 cycles est conforme aux
limites.

E.3.2 Évaluation du résultat

Remplacer l'équation existante:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{\text{RMS}}(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

par:

$$A(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} U_{\text{RMS}}(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$

E.4.2 Évaluation du résultat

Remplacer l'équation existante:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{j2\pi Nk} \right\|, N = 45, 46, 47$$

par:

$$B(N) = \left\| \frac{1}{50\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{99} H(k) e^{\frac{j2\pi Nk}{100}} \right\|, N = 45, 46, 47$$